

## ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВІЗОЛЮЮЧИХ МОНОКРИСТАЛІВ CdTe:Cl, ВИРОЩЕНИХ ІЗ ГАЗОВОЇ ФАЗИ

В. Д. Попович<sup>1</sup>, Г. М. Григорович<sup>2</sup>, Р. М. Пелещак<sup>2</sup>, П. М. Ткачук<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича,  
вул. М. Коцюбинського, 2, Чернівці, 58012, Україна

<sup>2</sup> Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,  
вул. І. Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна

(Отримано 23 травня 2001 р.)

Описано парофазний метод отримання високоомних монокристалів CdTe:Cl. Подано результати дослідження фотолюмінесценції цих кристалів залежно від умісту легуючої домішки у вихідному матеріалі. Вимірюванням електричних та фотоелектрических властивостей виявлено енергетичне положення рівня, який визначає електропровідність одержаних монокристалів.

**Ключові слова:** телурід кадмію, газова фаза, хлор, енергетичні рівні, фотопровідність, фотолюмінесценція.

PACS number(s): 73.61.Ga

### I. ВСТУП

Останнім часом дуже зросла зацікавленість в отриманні структурно досконалих напівізолюючих монокристалів телуріду кадмію для створення на їхній основі детекторів  $\gamma$ -випромінювання та рентгенівських променів, які працюють при кімнатній температурі. Одним із методів одержання високоомного CdTe є його компенсуюче легування в процесі вирощування. Як правило, легуючим елементом виступає хлор. Завдяки явищу самокомпенсації [1, 2] досягається рівновага між концентраціями донорних та акцепторних рівнів, що робить матеріал напівізолюючим.

Для отримання високоомного CdTe:Cl великих розмірів найширше використовують методи вирощування з рідкої фази: різні модифікації методів Бріджмена [3, 4] і зонної плавки [5, 6]. Одержані таким чином матеріал є високоомним (пітомий опір  $\rho > 10^8 \text{ Ом}\cdot\text{см}$ ) і має хороші властивості переносу (добуток рухливості на час життя  $\mu \cdot \tau = 10^{-4} \div 2 \cdot 10^{-3} \text{ см}^2/\text{В}$  для електронів та  $10^{-5} \div 10^{-4} \text{ см}^2/\text{В}$  для дірок). Проте однорідність та структурна досконалість (наявність двійників, мікроріщин) таких кристалів є ще недостатньою, що знижує вихід детекторного матеріалу.

З цієї точки зору прийнятнішими видаються методи вирощування з газової фази, які передбачають нижчу температуру росту. Нещодавно було здійснено спроби одержання напівізолюючого CdTe:Cl методом хемічних транспортних реакцій [7] і модифікованим методом Маркова [8].

У нашій роботі показано можливість отримання великих однорідних високоомних монокристалів CdTe:Cl методом сублімації у вакуумі та досліджено деякі їхні фізичні властивості.

### II. ОДЕРЖАННЯ КРИСТАЛІВ

Одержання кристалів включає два етапи: синтез хемічної сполуки (шихти) і безпосереднє формування монокристала. Це дає можливість на першому етапі підібрати умови для отримання однорідної за хемічним складом шихти, а на другому — звернути основну увагу на формування структурно досконалих монокристалів необхідного розміру.

Синтез шихти проводили у відкачаних до  $p = 10^{-5}$  Тор кварцових ампулах. Як вихідні матеріали використовували Cd і Te марки “Екстра” та попередньо обезводжену сіль CdCl<sub>2</sub>. Відповідні наважки розраховували на підставі припущення, що атоми хлору займають у матриці CdTe місце атомів телуру. Відпаяну ампулу поміщають в горизонтальну двосекційну піч, де поступово нагрівали в безградієнтному режимі до температури на  $5 \div 10^\circ\text{C}$  вищої за температуру плавлення CdTe з одночасним обертанням із швидкістю  $10 \text{ хв}^{-1}$ . При цих умовах ампулу витримували протягом 12 годин, щоб відбувся повний синтез сполуки. Після цього температуру в печі понижували приблизно на  $50^\circ\text{C}$  і між кінцями ампули встановлювався градієнт у  $20 \div 30^\circ\text{C}$ . Такий режим приводив до інтенсивного переносу матеріалу через газову фазу в холоднішу частину ампули. Потім знак градієнта змінювався на протилежний. Оскільки конвекційні потоки в газовій фазі при такому температурному режимі є дуже значними, а хлор — летким елементом, то після 2–3 повних переносів досягається майже рівномірний розподіл легуючої домішки (Cl) за об'ємом шихти.

Якість синтезованого злитка шихти контролювали за її пітомим опором, який визначали безконтактним методом за допомогою вимірювача добротності Е 9-4, використовуючи таке співвідношення [9]:

$$\rho = k \frac{Q_1 Q_2}{Q_1 - Q_2} \frac{f n^2 R^4 l}{L}, \quad (1)$$

де  $\rho$  — питомий опір шихти ( $\Omega \cdot \text{см}$ );  $f$  — частота вимірювань (МГц);  $L$  — індуктивність катушки без злитка ( $\mu\text{Гн}$ );  $n$  — число витків на 1 см катушки ( $\text{см}^{-1}$ );  $R$  — радіус злитка (см);  $l$  — довжина злитка (см);  $Q_1$  — добротність катушки на частоті  $f$  без злитка;  $Q_2$  — добротність катушки на тій же частоті зі злитком усередині катушки; коефіцієнт  $k = 1.945 \cdot 10^{-4}$ .

Другий етап отримання CdTe:Cl полягає в безпосередньому формуванні монокристала з попередньо механічно подрібненої шихти шляхом сублімації в ампулі спеціальної форми, відкачаний до  $p = 10^{-5}$  Тор. Температурний профіль вертикальної печі для вирощування монокристала підбирали так, щоб забезпечити попередню очистку місця зародкоутворення та росту від дрібних частинок шихти, які могли туди попасті під час відкачки. Крім того, швидкість росту кристала при такому температурному режимі дорівнювала швидкості відкачування ампули.

Описаним вище способом було отримано монокристали CdTe:Cl завдовжки до 40 мм і діаметром до 18 мм (рис. 1). Вирощено кристали з трьома різними розрахунковими концентраціями хлору в наважці:  $N_{\text{Cl}} = 10^{17}$ ,  $10^{18}$  і  $10^{19} \text{ см}^{-3}$ .

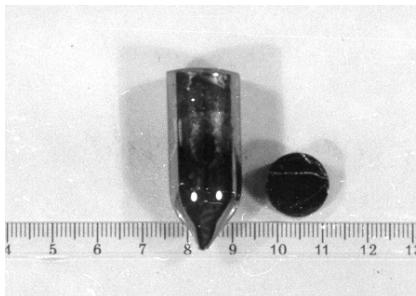


Рис. 1. Монокристал CdTe:Cl, вирощений з газової фази.

### III. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ

Для оцінки однорідності та кристалічної якості на отриманих монокристалах CdTe:Cl було проведено дослідження фотолюмінесценції в ділянці довжин хвиль  $750 \div 1000$  нм при 77.3 К. Спектри фотолюмінесценції досліджували на свіжих сколах, узятих із різних частин злитків усіх трьох концентрацій. Для збудження використовували гелій-неоновий лазер ( $\lambda = 632.8$  нм) потужністю  $P = 40$  мВт і діаметром світлового пучка 0.1 мм. Аналіз фотолюмінесцентного випромінювання проводили монохроматором типу МДР-24 з дифракційною ґраткою 600 штрихів/мм.

Типові спектральні залежності стаціонарної фотолюмінесценції отриманих монокристалів CdTe:Cl зображені на рис. 2. Спектр фотолюмінесценції кристалів із концентрацією введеного хлору  $N_{\text{Cl}} = 10^{18}$  і

$10^{19} \text{ см}^{-3}$  складається з вузької лінії 1.582 еВ та широкої безструктурної смуги в ділянці 1.4 еВ. У спектрі фотолюмінесценції кристалів із  $N_{\text{Cl}} = 10^{17} \text{ см}^{-3}$  чітко проявляється додаткова смуга значно меншої інтенсивності з максимумом при 1.545 еВ.

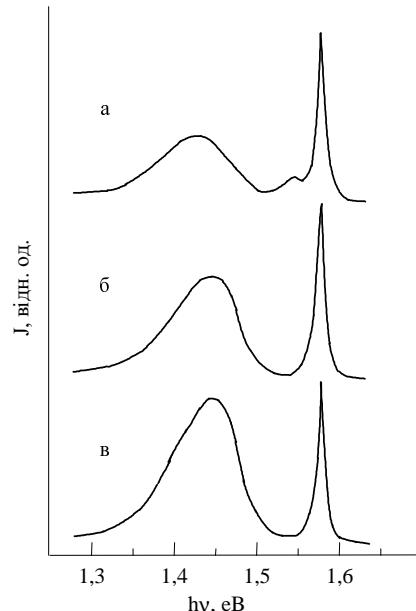


Рис. 2. Спектральні залежності стаціонарної фотолюмінесценції монокристалів CdTe:Cl, вирощених із газової фази при  $T = 77.3$  К. Розрахункова концентрація хлору в наважці: а —  $N_{\text{Cl}} = 10^{17} \text{ см}^{-3}$  б —  $N_{\text{Cl}} = 10^{18} \text{ см}^{-3}$  в —  $N_{\text{Cl}} = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ .

Домінуюча смуга 1.582 еВ є результатом випромінювальної рекомбінації екситонів у CdTe [10, 11]. Велика ширина безструктурної несиметричної смуги 1.4 еВ вказує на неелементарний характер відповідного випромінювального процесу. Вона зумовлена донорно-акцепторною рекомбінацією. Донором є хлор, який утворює дрібний воднеподібний рівень  $E_d = E_c - 0.014$  еВ, а в ролі акцепторів виступають А-центрі, які складаються з атомів заміщення хлору на місці телуру й найближчої вакансії в підґратці кадмію:  $(\text{V}_{\text{Cd}}\text{Cl}_{\text{Te}})^-$  [12]. Ці комплекси утворюють у забороненій зоні CdTe енергетичні рівні, розміщені на 0.14 еВ вище від верхнього краю валентної зони [13]. Максимум смуги для кристалів із концентрацією хлору в наважці  $N_{\text{Cl}} = 10^{18}$  і  $10^{19} \text{ см}^{-3}$  припадає на  $h\nu_{max} = 1.447$  еВ. Тоді як максимум для зразків із  $N_{\text{Cl}} = 10^{17} \text{ см}^{-3}$  зміщено в довгохвильову ділянку:  $h\nu_{max} = 1.432$  еВ.

Таку концентраційну залежність спектрів фотолюмінесценції, очевидно, можна пояснити в межах моделі деформаційного потенціялу [14]. Її суть полягає в тому, що легування приводить до виникнення деформації ґратки CdTe внаслідок відмінності іонних радіусів хлору й телуру. Це є причиною зміни енергетичних положень А-центра, рівня  $\text{Cl}_{\text{Te}}^+$ , дна зони провідності та вершини валентної зони, величина

якої залежить від концентрації введеної домішки. Величина енергетичного зсуву піка фотолюмінесценції смуги 1.4 еВ в межах цієї моделі визначається за співвідношенням:

$$\begin{aligned} h(\nu_{2\max} - \nu_{1\max}) = & E_{\text{Cl}^+}(\bar{\varepsilon}_2) - E_{\text{Cl}^+}(\bar{\varepsilon}_1) \\ & + E_{(\text{V}_{\text{Cd}}\text{Cl}_{\text{Te}})}(\bar{\varepsilon}'_1) - E_{(\text{V}_{\text{Cd}}\text{Cl}_{\text{Te}})}(\bar{\varepsilon}'_2), \end{aligned} \quad (2)$$

де  $\bar{\varepsilon}_1$  і  $\bar{\varepsilon}_2$  — деформація ґратки CdTe, зумовлена домішками заміщення  $\text{Cl}_{\text{Te}}^+$  з концентраціями відповідно  $n_1$  та  $n_2$ ;  $E_{\text{Cl}^+}(\bar{\varepsilon}_2)$ ,  $E_{\text{Cl}^+}(\bar{\varepsilon}_1)$  — енергетичні положення рівня  $\text{Cl}_{\text{Te}}^+$  щодо вершини валентної зони при цих концентраціях;  $\bar{\varepsilon}'_1$  і  $\bar{\varepsilon}'_2$  — деформація ґратки CdTe, зумовлена А-центраторами з концентраціями відповідно  $n'_1$  та  $n'_2$ ;  $E_{(\text{V}_{\text{Cd}}\text{Cl}_{\text{Te}})}(\bar{\varepsilon}'_1)$ ,  $E_{(\text{V}_{\text{Cd}}\text{Cl}_{\text{Te}})}(\bar{\varepsilon}'_2)$  — енергетичні положення А-центратора щодо вершини валентної зони при цих концентраціях. Кількісна оцінка величини зсуву, проведена згідно із цим співвідношенням для кристалів з  $N_{\text{Cl}} = 10^{17}$  і  $10^{19} \text{ см}^{-3}$ , задовільно узгоджується з експериментальними даними та становить  $\sim 10$  мeВ.

Смуга 1.545 еВ, що характерна для кристалів із концентрацією хлору в наважці  $N_{\text{Cl}} = 10^{17} \text{ см}^{-3}$ , можна інтерпретувати як результат випромінюваного переходу зона провідності—акцептор, що є домінуючим типом переходів у цій ділянці спектра при азотній температурі [15]. Енергію йонізації акцептора  $E_A$  оцінююмо з положення максимуму цієї смуги [16]:

$$h\nu_{\max} = E_g - E_A + \frac{1}{2}kT_e, \quad (3)$$

де  $E_g = 1.595$  еВ — ширина забороненої зони CdTe при 77.3 К;  $T_e$  — температура електронів, що збігається при використаних низьких рівнях збудження з температурою ґратки. Отримане значення  $E_A = 0.055$  еВ добре узгоджується з енергетичним положенням центрів, створених однократно йонізованою вакансією кадмію  $\text{V}_{\text{Cd}}^-$ , концентрація яких є значною при цьому рівні легування хлором [13].

Слід відзначити, що інтенсивність відповідних смуг фотолюмінесценції для зразків, узятих із різних частин одного злитка, майже не змінювалася. Це свідчить про високий ступінь однорідності отриманих монокристалів CdTe:Cl.

#### IV. ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Вимірювання ефекту Голла показало, що отримані монокристали CdTe:Cl з концентрацією хлору в наважці  $N_{\text{Cl}} = 10^{18}$  та  $10^{19} \text{ см}^{-3}$  при кімнатній температурі мають питомий опір  $\rho = (3 \div 4) \cdot 10^8 \text{ Ом} \cdot \text{см}$  і є  $n$ -типу провідності. Концентрація основних носіїв (електронів)  $n = (5 \div 7) \cdot 10^7 \text{ см}^{-3}$ , а їх рухливість  $\mu_n = 300 \div 400 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$ . Кристали з  $N_{\text{Cl}} = 10^{17} \text{ см}^{-3}$  мають  $p$ -типу провідності, а їхній питомий опір приблизно на два порядки нижчий. Це відповідає резуль-

татам дослідження фотолюмінесценції і пояснюється значною концентрацією дрібних акцепторних центрів  $\text{V}_{\text{Cd}}^-$  у кристалах із  $N_{\text{Cl}} = 10^{17} \text{ см}^{-3}$ .

Для виявлення глибоких рівнів, які відіграють визначальну роль в електричних властивостях і властивостях переносу, на отриманих напівізолюючих монокристалах CdTe:Cl було досліджено температурні залежності темнового струму. Контакти для цих (як і для фотоелектричних) вимірювань виготовляли вплавленням металічного індію на свіжих кристалічних сколах. Щоб уникнути можливих впливів термостимулюваних струмів перед початком вимірювань, усі зразки прогрівали до 330 К і довго витримували в темноті при кімнатній температурі.

Типові температурні залежності темнового струму кристалів з  $N_{\text{Cl}} = 10^{18}$  і  $10^{19} \text{ см}^{-3}$  наведено на рис. 3. Видно, що в ділянці температур  $\sim 250 \div 330$  К енергія активації електропровідності є однаковою (0.66 еВ) для обох концентрацій. Оскільки ці кристали мають  $n$ -тип провідності, то ця енергія відповідає йонізації рівня, розташованого нижче від дна зони провідності на 0.66 еВ.

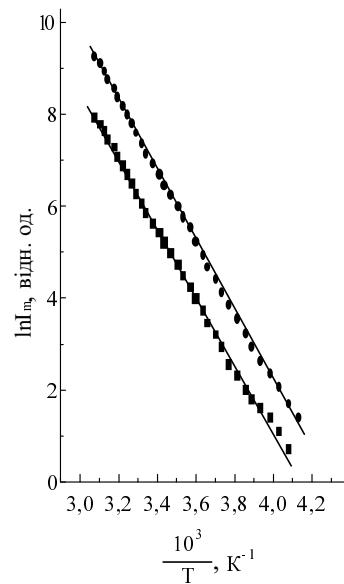


Рис. 3. Температурна залежність темнового струму монокристалів CdTe:Cl, вирощених із газової фази. Розрахункова концентрація хлору в наважці: • —  $N_{\text{Cl}} = 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ; ■ —  $N_{\text{Cl}} = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ .

#### V. ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Отримані монокристали CdTe:Cl з  $N_{\text{Cl}} = 10^{18}$  і  $10^{19} \text{ см}^{-3}$  характеризуються високою фоточутливістю у власній ділянці спектра як при азотній, так і при кімнатній температурах. На рис. 4 наведені спектри фотопровідності цих кристалів при 80 К. Спектральне положення абсолютних максимумів фоточутливості дуже близькі до ширини забороненої зони CdTe при цій температурі. На спектрах обох зразків

чітко проявляється ділянка домішкової фотопровідності при  $h\nu < 1.3$  еВ. Енергетичне положення центра, який відповідає за неї, можна визначити за початком різкого росту фоточутливості. Він розміщений на 0.8 еВ нижче від дна зони провідності.

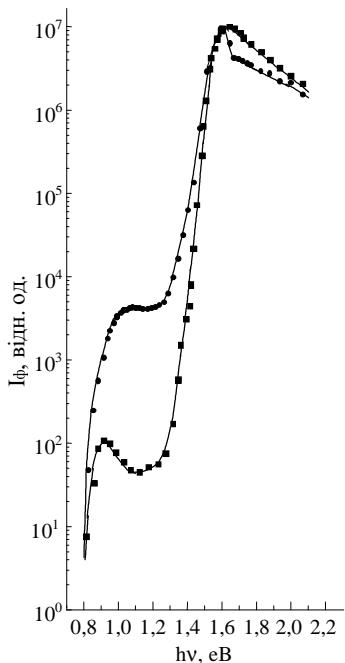


Рис. 4. Спектральна залежність фотопровідності (наведена на однакове число квантів) монокристалів CdTe:Cl, вирощених із газової фази. Розрахункова концентрація хлору в наважці: • —  $N_{\text{Cl}} = 10^{18} \text{ см}^{-3}$  ■ —  $N_{\text{Cl}} = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ .

Для одержання додаткової інформації про локалізацію центрів чутливості на кристалах з  $N_{\text{Cl}} = 10^{18}$  і  $10^{19} \text{ см}^{-3}$  досліджували оптичне гасіння фотоструму при постійній власній підсвітці. Його спектральний розподіл при 80 К зображенено на рис. 5. За довгохвильовим краєм смуги гасіння можна визначити енергетичне положення цих центрів щодо верхнього краю валентної зони. Отримано значення:  $E_c + 0.94$  еВ. Прийнявши ширину забороненої зони CdTe при азотній температурі 1.595 еВ, одержимо положення центрів щодо дна зони провідності:  $E_c - 0.655$  еВ. Це значення практично збігається з положенням рівня, визначеного з температурної залежності темнового струму.

З великою ймовірністю можна також стверджувати, що цей же центр проявляється й у домішковій фотопровідності напівізолюючих монокриста-

лів CdTe:Cl. Рівні з близькими енергіями йонізації часто пов'язувались з двоократно йонізованою вакансією кадмію  $V_{\text{Cd}}^{2-}$  [13, 17]. Значну різницю між величинами термічної та оптичної енергії йонізації в такому разі можна пояснити необхідністю подолання кулонівського бар'єра, пов'язаного з центром  $E_c - 0.66$  еВ. Проте недавні дослідження показали, що вакансії кадмію не можуть утворювати енергетичного рівня, розміщеного вище, ніж 0.47 еВ над вершиною валентної зони CdTe [18]. Тому для вияснення природи виявлених центрів потрібні детальніше дослідження.

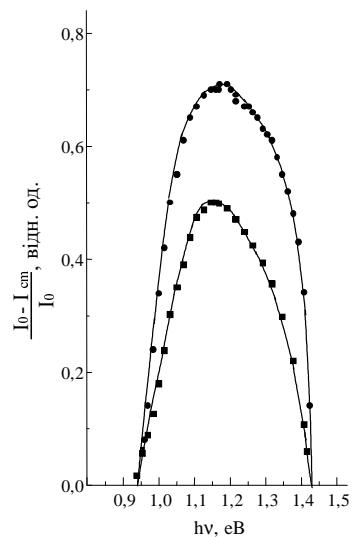


Рис. 5. Спектральний розподіл оптичного гасіння фотоструму монокристалів CdTe:Cl, вирощених з газової фази при 80 К, ( $I_0$  — фоновий струм;  $I_{\text{cm}}$  — фотострум, який встановився під дією інфрачервоного гасіння). Розрахункова концентрація хлору в наважці: • —  $N_{\text{Cl}} = 10^{18} \text{ см}^{-3}$  ■ —  $N_{\text{Cl}} = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ .

## VI. ВИСНОВОК

Показано можливість отримання великих однорідних монокристалів CdTe:Cl з газової фази. Напівізолюючі ( $\rho = 3 \div 4 \cdot 10^8 \text{ Ом} \cdot \text{см}$ ) кристали  $n$ -типу провідності було одержано при розрахунковій концентрації хлору у вихідному матеріалі  $N_{\text{Cl}} \geq 10^{18} \text{ см}^{-3}$ . Це пояснено зниженням концентрації дрібних акцепторних рівнів  $E_v + 0.055$  еВ із підвищенням ступеня легування. Виявлено, що провідність отриманих таким способом монокристалів CdTe:Cl у температурному діапазоні 250–330 К визначається рівнем, розміщеним на 0.66 еВ нижче від дна зони провідності.

- 
- [1] F. A. Kroger, J. Vink, Phys. Status Solidi **3**, 310 (1956).  
[2] G. Mandel, Phys. Rev. A **134**, 1073 (1964).  
[3] T. I. Milenov, M. M. Gospodinov, Nucl. Instrum. Meth-

- ods Phys. Res. A **322**, 368 (1992).  
[4] P. Hoshl, P. Polivka, M. Vanecak, M. Skrivankova, Rev. Phys. Appl. **12**, 229 (1977).

- [5] R. Triboulet, Prog. Cryst. Gr. Char. Mater. **85**, 128 (1994).
- [6] T. Shoji, H. Onabe, Y. Hiratake, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A **322**, 324 (1992).
- [7] Н. А. Українець, дисерт. канд. фіз.-мат. наук, Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, (2000).
- [8] M. Fiederle, T. Feltgen, M. Rogalla, J. Mehnhardt, J. Ludwig, K. Runge, K. W. Benz, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A **434**, 152 (1999).
- [9] А. Л. Грохольский, *Измерители добродонности — куметры* (Наука, Новосибирск, 1966).
- [10] Ж. Р. Паносян, Труды физ. инст. им. П. Н. Лебедева АН СССР **68**, 147 (1973).
- [11] Н. В. Агринская, Н. Н. Зиновьев, О. А. Матвеев, И. Д. Ярошецкий, Физ. техн. полуфр. **14**, 172 (1980).
- [12] Р. А. Ильчук, Н. А. Украинец, В. И. Иванов-Омский, Ю. В. Рудь., В. Ю. Рудь, Физ. техн. полуфр. **33**, 553 (1999).
- [13] M. Hage-Ali, P. Siffert, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A **322**, 313 (1992).
- [14] А. С. Давидов, *Теория твердого тела* (Наука, Москва, 1976).
- [15] Н. В. Агринская, О. А. Матвеев, А. В. Никитин, Б. А. Сладкова, Физ. техн. полуфр. **21**, 676 (1987).
- [16] J. Saraie, H. Shinohara, H. Edanatzu, T. Tanaka, J. Lumin **21**, 337 (1980).
- [17] Н. В. Агринская, Е. Н. Аркадьева, О. А. Матвеев, Ю. В. Рудь, Физ. техн. полуфр. **2**, 932 (1968).
- [18] B. K. Meyer, W. Stadler, J. Cryst. Growth **161**, 119 (1996).

## PHYSICAL PROPERTIES OF SEMIINSULATING CdTe:Cl MONOCRYSTALS GROWN FROM VAPOUR PHASE

V. D. Popovych<sup>1</sup>, G. M. Grygorovych<sup>2</sup>, R. M. Peleschak<sup>2</sup>, P. M. Tkachuk<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Yuriy Fedkovych National University,  
2 Kotsubynsky Str., Chernivtsi, 58102, Ukraine*

*E-mail: vpopovych@yahoo.com*

<sup>2</sup> *Ivan Franko State Pedagogical University of Drohobych,  
24 Franko Str., Drohobych, 82100, Ukraine*

Vapour phase method of high resistivity CdTe:Cl monocrystals growth is described. Photoluminescence spectra are investigated in dependence of the doping impurity. Electric and photoelectric studies resulted in the energy position of the level located in the band-gap responsible for the electroconductivity of the grown crystals.